

Corrigé de l'EMD : Module physique des semi-conducteurs

Niveau L3 : PM

Date : 16-05-2024

Exercice 01 : (06 points)

1- Un S.C III-V est composé d'un élément de la colonne III (un métal) tel que l'Indium (In) et un élément de la colonne V (non métal) tel que le phosphore (P). La structure Zinc Blende est similaire à celle dite Diamant où le réseau est cubique à faces centrées (CFC). Le motif est constitué de deux atomes différents : le phosphore P occupant les nœuds du réseau CFC et les atomes d'Indium In occupant les positions $(1/4, 1/4, 1/4)$, $(1/4, 3/4, 3/4)$, $(3/4, 1/4, 3/4)$ et $(3/4, 3/4, 1/4)$. 01,00

2- La densité atomique des plans (100) et (110) : tracé des plans est demandé 00,50

$$\text{le plan (100): } N_{(100)} = \frac{4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 1}{a^2} = \frac{2}{(5.87 \times 10^{-8})^2} = 5,8 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-2}$$

$$\text{le plan (110): } N_{(110)} = \frac{4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)}{a \cdot a \sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot (5.87 \times 10^{-8})^2} = 4,1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-2}$$
01,00

3- La densité atomique = nombre d'atomes renfermé dans le cube/ volume de cube (cm^3), alors 01,00

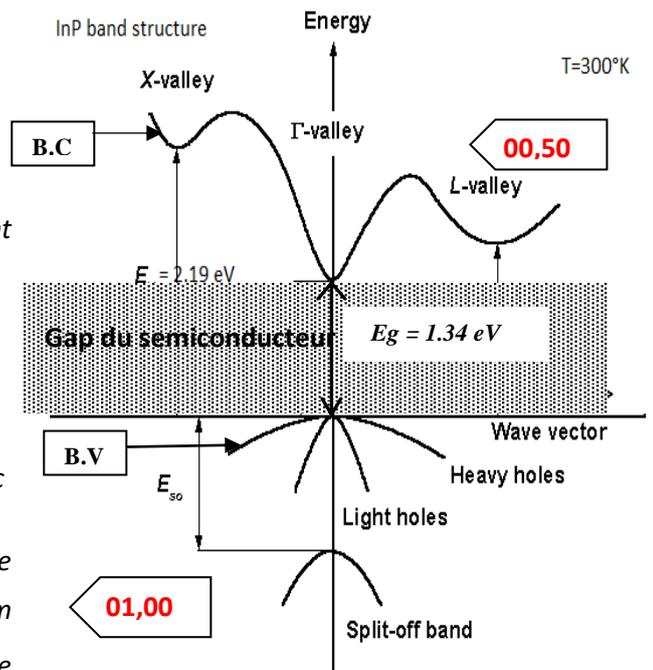
$$N_{\text{InP}} = \text{nombre d'atomes} / a^3 = \frac{1+3+4}{(5.87 \times 10^{-8})^3} = 3,95 \cdot 10^{22}$$

$$\text{cm}^3 \Rightarrow N_{\text{In}} = N_{\text{P}} = N_{\text{InP}} / 2 = 3,95 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

4- D'après le schéma de structures de bandes d'énergie, le sommet de la (BV) E_v se trouve en position $\Gamma(0, 0, 0)$ qui représente le centre de 1^{ère} Z.B, et le bas de la (B.C) E_c se trouve également à la même position $\Gamma(0, 0, 0)$. Etant donné qu'il existe un seul centre $\Gamma(0, 0, 0)$ le schéma de bandes présente un seul minima E_c on dit que ce semiconducteur est mono-vallée. Puisque les positions du bas de la B.C et du sommet de B.V se trouvent à la même position $\Gamma(0, 0, 0)$, le semiconducteur est à gap direct \Rightarrow les recombinaisons dans ce semiconducteur sont donc radiatives. 01,00

5- L'énergie de gap : $E_g = 1.34 \text{ eV}$ à 300°K . La longueur d'onde de coupure pour l'InP : $\lambda_g = \frac{hc}{E_g} = 1240 / 1,34 = 925.37 \text{ nm}$

(longueur d'onde qui correspond à un rayonnement proche infrarouge). Ce Le matériau se trouve son application dans la fabrication des diodes laser infrarouge.



Exercice 02 : (13.5 points)

1. La densité n des électrons dans la (BC) est donnée par :

$$n = \int_{E_c}^{\infty} f_n(E, T) \cdot N_c(E) dE \quad \text{avec} \quad f_n(E, T) = \left[1 + \exp\left(\frac{E - E_f}{kT}\right) \right]^{-1} \rightarrow (01,00)$$

Pour un semiconducteur non dégénéré le niveau de Fermi se trouve dans a B.I et on aura la différence :

$$E - E_f = qq \cdot kT \Rightarrow \exp\left[\left(\frac{E - E_f}{kT}\right)\right] \gg 1 \Rightarrow f_n(E, T) \approx \exp\left[\left(\frac{E_f - E}{kT}\right)\right] \rightarrow (0.50)$$

$$n = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{E_c}^{\infty} \exp \left[\left(\frac{E_f - E}{kT} \right) \right] (E - E_c)^{1/2} dE$$

Après calcul (détail de calcul nécessaire) et le changement de variable $= \left(\frac{E - E_c}{kT} \right)$, l'intégrale devient de la forme \rightarrow **(02.00)**

$$n = A \cdot (kT)^{3/2} \int_0^{\infty} \sqrt{x} \cdot e^{-x} \cdot dx = 2 \left(\frac{2m_e^* \pi kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp \left(\frac{E_f - E_c}{kT} \right) = N_c \cdot \exp \left(\frac{E_f - E_c}{kT} \right)$$

2. La densité des trous, par analogie à la densité des électrons, est donnée par \rightarrow **(0.50)**

$$p = N_v \cdot \exp \left(\frac{E_v - E_f}{kT} \right) = N_v \cdot \exp \left(\frac{-E_f}{kT} \right) \text{ avec } N_v = 2 \left(\frac{2m_e^* \pi kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

3.a. Un semiconducteur intrinsèque est un SC dépourvu de toute impureté susceptible de modifier la densité des porteurs de charges libres à l'équilibre. \rightarrow **(0.50)**

3. b. Dans un tel semiconducteur on a $n = p = n_i$. En utilisant la loi d'action de masse $n \cdot p = n_i^2$ nous trouvons l'expression de la densité intrinsèque $n_i = (N_v \cdot N_c)^{1/2} \exp(-E_g/2kT)$. \rightarrow **(0.75)**

3.c. L'énergie de niveau de Fermi du semiconducteur intrinsèque E_{Fi} est calculée en écrivant ;

$$n = p \Rightarrow N_c \cdot \exp \left(\frac{E_{Fi} - E_c}{kT} \right) = N_v \cdot \exp \left(\frac{E_v - E_{Fi}}{kT} \right) \Rightarrow E_{Fi} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{2} kT \cdot \ln \left(\frac{N_v}{N_c} \right). \rightarrow$$
 (0.50)

A.N : A température ambiante, pour l'lnP : $n_i = (1,1 \cdot 10^{19} \times 5,7 \cdot 10^{17})^{1/2} \exp(-1,34/2 \times 26 \cdot 10^{-3}) = 1,61 \cdot 10^7 \text{ cm}^{-3}$. $E_{Fi} = (1,34/2) + \frac{26}{2} \cdot 10^{-3} \ln \left(\frac{5,7 \cdot 10^{17}}{1,1 \cdot 10^{19}} \right) = 0,63 \text{ eV}$. \rightarrow **(01.00)**

4. La conductivité intrinsèque équivalente est donnée par : $\sigma_i = n_i e \mu_n + n_i e \mu_p = n_i e (\mu_n + \mu_p)$. A.N : $\sigma_i = 1,61 \cdot 10^7 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} (4600 + 150) = 1,22 \cdot 10^{-8} \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$. Cette conductivité est trop faible et le semiconducteur intrinsèque est semi-isolant. \rightarrow **(01.00)**

5.a. Un atome donneur est un atome impureté introduit volontairement dans un SC dans le but d'augmenter la densité des électrons libres. Il généralement de de valence égale à 5. Il se place dans le cristal de semiconducteur en position de substitution. Il développe, par conséquent, 4 liaisons covalentes avec les atomes du SC proches voisins. Le 9^{ème} électron se trouve alors sur une orbitale délocalisé dans le champ de l'ion d'atome donneur D^+ à Température ambiante, par conséquent il se trouve dans la BC à cette température. Cet atome est alors donneur d'un électron. un tel dopage a pour effet d'augmenter la densité des électrons libres dans le SC et par conséquent améliorer la conductivité électrique de celui-ci. \rightarrow **(01.50)**

5.b. Le calcul de la densité des électrons en fonction de la densité des donneurs N_d , des accepteurs N_a et de la densité des porteurs intrinsèques n_i à température ambiante donne (voir le cours) :

$$n = \frac{1}{2} \left[(N_d - N_a) + \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4n_i^2} \right] \rightarrow$$
 (0.50)

Dans notre cas, le SC est dopé par des donneurs c.-à-d. $N_d \gg N_a$, $N_d \gg n_i$, on néglige n_i et N_a devant N_d , ce qui donne $n \approx N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. et $p = (n_i^2/n) \approx (n_i^2/N_d) \approx 0$. Le semiconducteur est alors de type n. \rightarrow **(01.00)**

5.c. La position du niveau de Fermi du SV de type n est trouvée à partir de l'équation

$$n = N_c \exp \left(\frac{E_{Fn} - E_c}{kT} \right) = N_d \Rightarrow E_c - E_{Fn} = kT \ln \left(\frac{N_c}{N_d} \right) = 0,1 \text{ eV} \rightarrow$$
 (01.00)

5.d. La conductivité électrique du SV de type n $\sigma_n = ne\mu_n + pe\mu_p \approx N_d e\mu_n = 7.36 \Omega^{-1}cm^{-1}$. On constate que $\sigma_n \gg \sigma_i$. Il est clair que le dopage a considérablement amélioré la conductivité électrique du semiconducteur d'où l'importance de ce procédé. → (01.00)

Schéma de bandes (plates) montrant les positions du niveau de Fermi E_{Fi} et E_{Fn} .

